



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206819715 U

(45)授权公告日 2017.12.29

(21)申请号 201720304868.X

(22)申请日 2017.03.27

(73)专利权人 苏州市科林源电子有限公司

地址 215000 江苏省苏州市苏州高新区浒
关分区石阳路2号

(72)发明人 文东升

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标
事务所(普通合伙) 44288

代理人 胡拥军 赵赛

(51)Int.Cl.

G09G 3/00(2006.01)

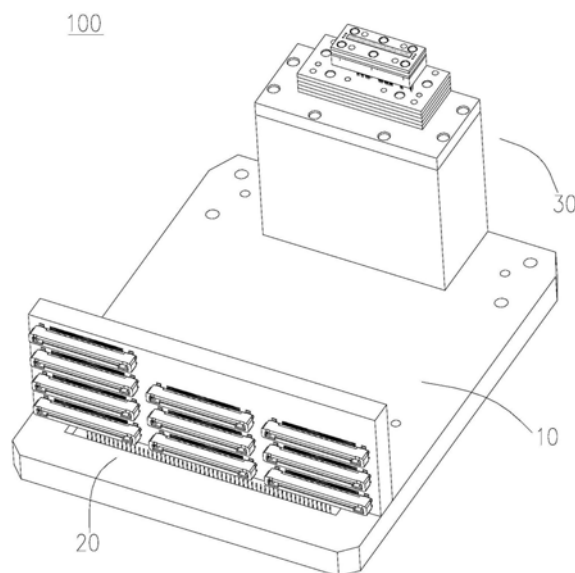
权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

OLED屏线路测试装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种OLED屏线路测试装置,包括一工作台、一连接结构及一测试结构,所述连接结构及所述测试结构分别固定安装于所述工作台,所述连接结构及所述测试结构与所述工作台电连接,所述测试结构包括一测试板及若干探针,所述若干探针固定安装于所述测试板并从所述测试板表面露出,所述若干探针通过所述工作台与所述连接结构电连接,所述若干探针用于接触OLED屏的线路进行线路检测。相比现有技术,本实用新型OLED屏线路测试装置的若干探针固定安装于测试板并从测试板表面露出,并且探针通过工作台与连接结构电连接,使探针能够接触OLED屏的线路进行线路检测,能够测试线宽线距很小的OLED屏线路。



1. 一种OLED屏线路测试装置,包括一工作台、一连接结构及一测试结构,所述连接结构及所述测试结构分别固定安装于所述工作台,所述连接结构及所述测试结构与所述工作台电连接,其特征在于:所述测试结构包括一测试板及若干探针,所述若干探针固定安装于所述测试板并从所述测试板表面露出,所述若干探针通过所述工作台与所述连接结构电连接,所述若干探针用于接触OLED屏的线路进行线路检测。

2. 根据权利要求1所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:每一所述探针的直径为10-30 μm 。

3. 根据权利要求2所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:每一所述探针的直径为20 μm 。

4. 根据权利要求1所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:每一所述探针露出所述测试板的长度为40-60 μm 。

5. 根据权利要求4所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:每一所述探针露出所述测试板的长度为50 μm 。

6. 根据权利要求1所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:所述测试结构还包括一测试模块,所述测试模块包括一主体,所述测试板固定于所述主体,所述若干探针收容于所述主体。

7. 根据权利要求6所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:所述测试结构还包括一连接模块及一支撑模块,所述测试模块固定安装于所述连接模块,所述连接模块固定安装于所述支撑模块并位于所述测试模块及所述支撑模块之间。

8. 根据权利要求7所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:所述测试结构还包括至少一安装部,所述工作台设有至少一安装孔,所述至少一安装部固定安装于所述支撑模块并与所述安装孔插接,使所述测试结构固定安装于所述工作台。

9. 根据权利要求1所述的OLED屏线路测试装置,其特征在于:所述连接结构包括一主体、若干插接部及若干针脚,所述若干插接部及所述若干针脚固定于所述主体,所述工作台设有一开口,所述若干针脚安装于所述开口。

OLED屏线路测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试治具,尤其是涉及一种线路测试装置。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,显示屏在生活中被广泛应用。对于消费者,显示屏的功能需多,且显示屏不能有功能故障。为了解决显示屏的功能问题,对于其出货的显示屏都需要反复专门测试。但有些显示屏的线路宽线距非常小,例如OLED显示屏,最小线宽线距仅为9 μm ,很难进行检测。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种能够测试线宽线距很小的OLED屏线路测试装置。

[0004] 本实用新型的目的采用以下技术方案实现:

[0005] 一种OLED屏线路测试装置,包括一工作台、一连接结构及一测试结构,所述连接结构及所述测试结构分别固定安装于所述工作台,所述连接结构及所述测试结构与所述工作台电连接,所述测试结构包括一测试板及若干探针,所述若干探针固定安装于所述测试板并从所述测试板表面露出,所述若干探针通过所述工作台与所述连接结构电连接,所述若干探针用于接触OLED屏的线路进行线路检测。

[0006] 优选的,每一所述探针的直径为10-30 μm 。

[0007] 优选的,每一所述探针的直径为20 μm 。

[0008] 优选的,每一所述探针露出所述测试板的长度为40-60 μm 。

[0009] 优选的,每一所述探针露出所述测试板的长度为50 μm 。

[0010] 优选的,所述测试结构还包括一测试模块,所述测试模块包括一主体,所述测试板固定于所述主体,所述若干探针收容于所述主体。

[0011] 优选的,所述测试结构还包括一连接模块及一支撑模块,所述测试模块固定安装于所述连接模块,所述连接模块固定安装于所述支撑模块并位于所述测试模块及所述支撑模块之间。

[0012] 优选的,所述测试结构还包括至少一安装部,所述工作台设有至少一安装孔,所述至少一安装部固定安装于所述支撑模块并与所述安装孔插接,使所述测试结构固定安装于所述工作台。

[0013] 优选的,所述连接结构包括一主体、若干插接部及若干针脚,所述若干插接部及所述若干针脚固定于所述主体,所述工作台设有一开口,所述若干针脚安装于所述开口。

[0014] 相比现有技术,本实用新型OLED屏线路测试装置的若干探针固定安装于测试板并从测试板表面露出,并且探针通过工作台与连接结构电连接,使探针能够接触OLED屏的线路进行线路检测,能够测试线宽线距很小的OLED屏线路。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型OLED屏线路测试装置的一分解图。

[0016] 图2为图1的OLED屏线路测试装置一测试结构的一立体图。

[0017] 图3为图2的测试结构的一测试模块的一立体图。

[0018] 图4为图3的测试模块A处的放大图。

[0019] 图5为图1的OLED屏线路测试装置的一组装图。

[0020] 图中：100、OLED屏线路测试装置；10、工作台；12、开口；14、安装孔；20、连接结构；22、主体；24、插接部；26、针脚；30、测试结构；32、测试模块；320、主体；322、测试板；324、探针；34、连接模块；36、支撑模块；38、安装部。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 需要说明的是，当组件被称为“固定于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0023] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0024] 请参阅图1至图5，一种OLED屏线路测试装置100包括一工作台10、一连接结构20及一测试结构30。

[0025] 所述工作台10设有一开口12及若干安装孔14，所述开口12及若干安装孔14分别位于所述工作台10的行对两端。所述工作台10内设置有特殊工艺处理的铜线。

[0026] 所述连接结构20包括一主体22、若干插接部24及若干针脚26。所述若干插接部24及所述若干针脚26固定安装于主体22。所述若干插接部24与所述若干针脚26电连接。

[0027] 所述测试结构30包括测试模块32、连接模块34、支撑模块36及若干安装部38。所述测试模块32包括一主体320、一测试板322、若干探针324。所述测试板322固定安装于所述主体320。所述若干探针324固定安装于所述测试板322并从所述测试板322表面露出。所述主体320固定安装于所述连接模块34。所述连接模块34固定安装于所述支撑模块36。所述连接模块34位于所述测试模块32及所述支撑模块36之间。所述若干安装部38固定安装于所述支撑模块36。每一所述探针324的直径为10-30 μm 。在一实施例中，所述探针324的直径为20 μm 。每一所述探针324露出所述测试板的长度为40-60 μm 。在一实施例中，每一所述探针324露出所述测试板的长度为50 μm 。

[0028] 组装所述OLED屏线路测试装置100时,所述连接结构20的若干针脚26安装于所述工作台10的开口12。所述插接部24通过所述若干针脚26与所述工作台10电连接。所述测试结构30的安装部38插接于所述工作台10的安装孔14中。此时所述探针324通过所述OLED屏线路测试装置100内部的铜线与所述插接部24电连接。

[0029] 使用所述OLED屏线路测试装置100时,将一OLED屏放置于所述测试结构30上,所述OLED屏的测试孔对准所述探针324,所述探针324伸入所述测试孔,所述连接结构20的插接部24与一测试仪插接,显示测试结果。

[0030] 本实用新型通过探针324能够测试线宽线距很小的OLED屏线路。

[0031] 对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

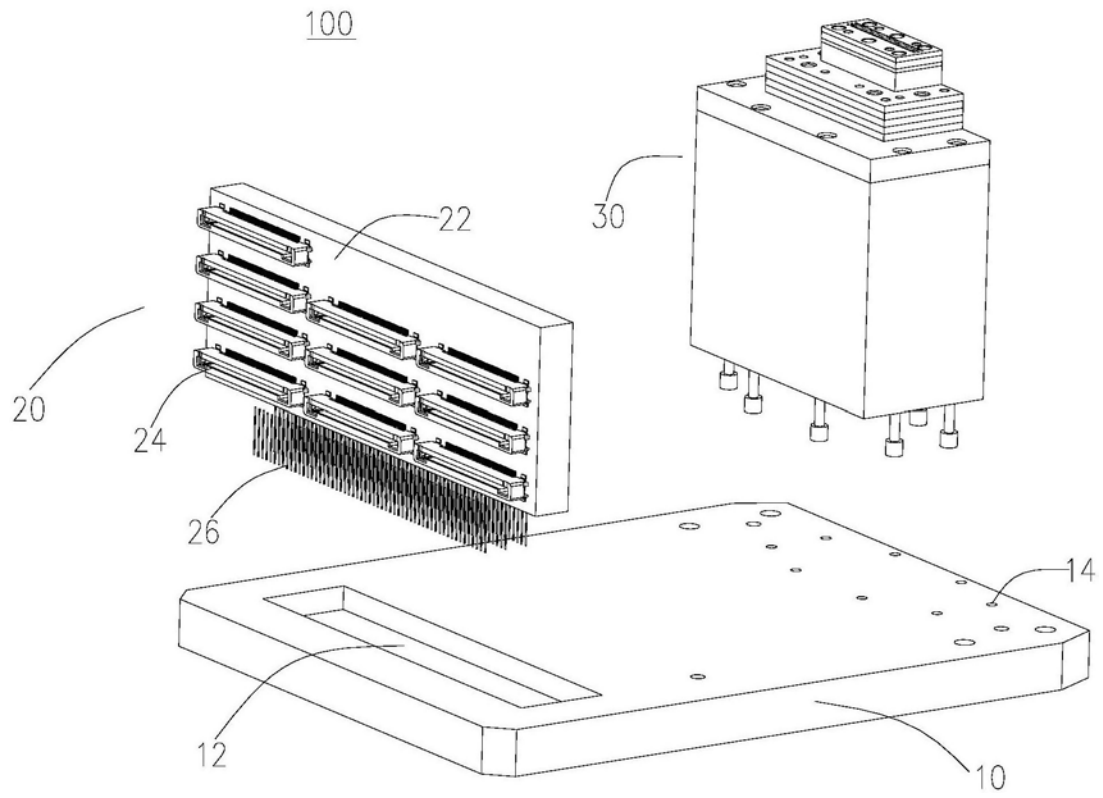


图1

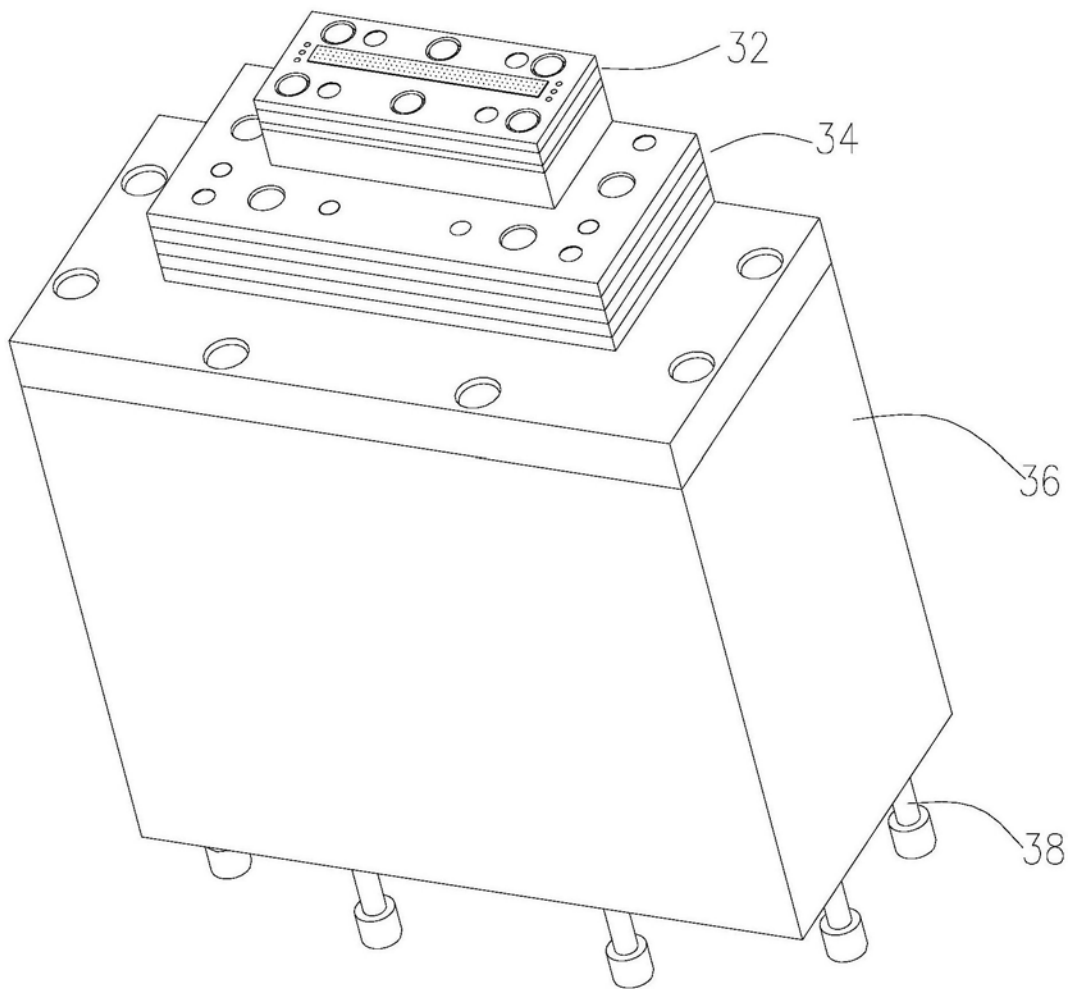
30

图2

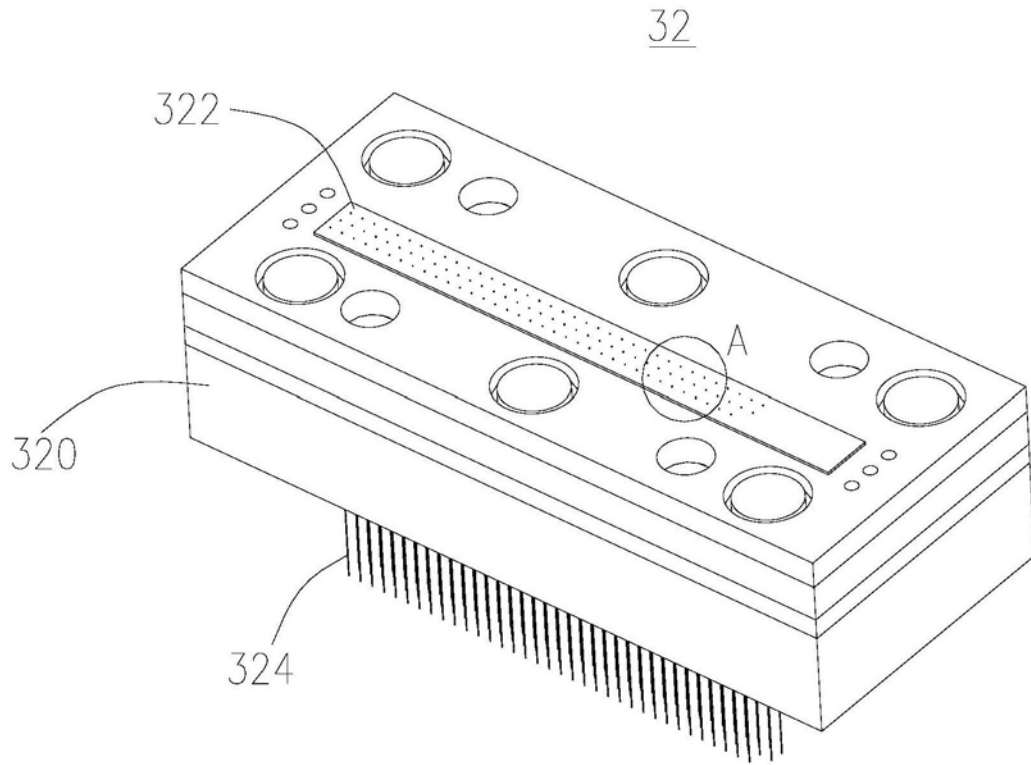


图3

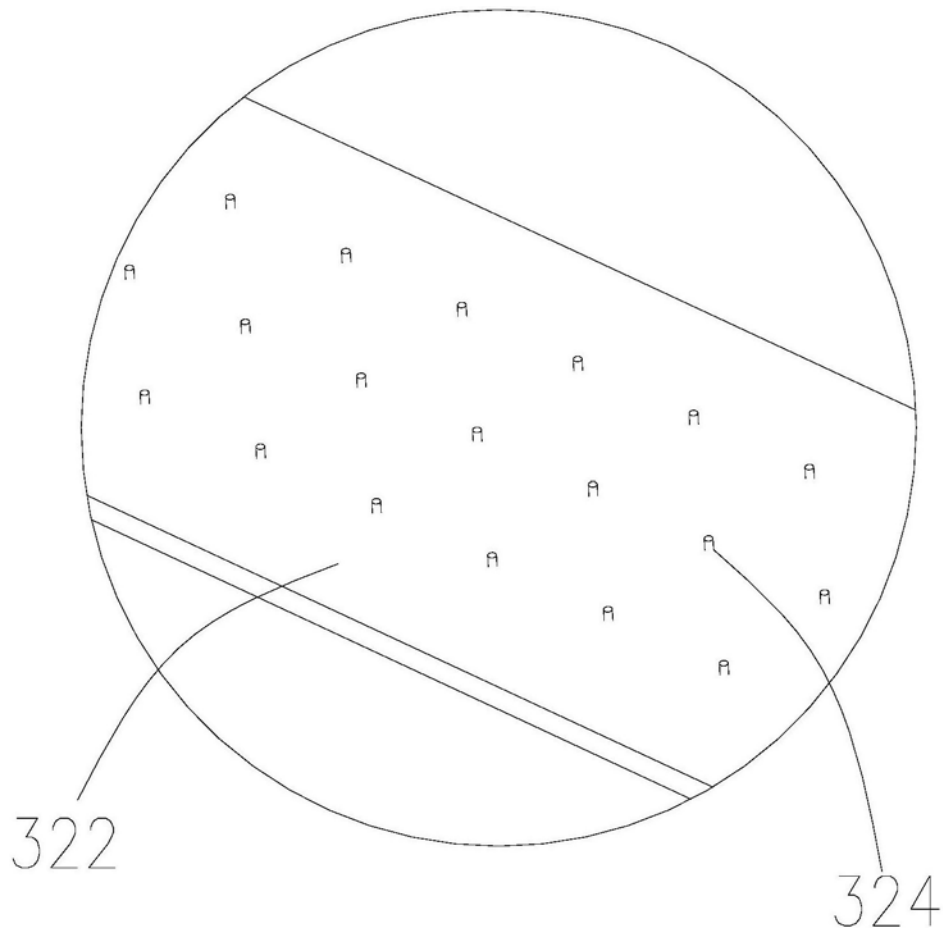


图4

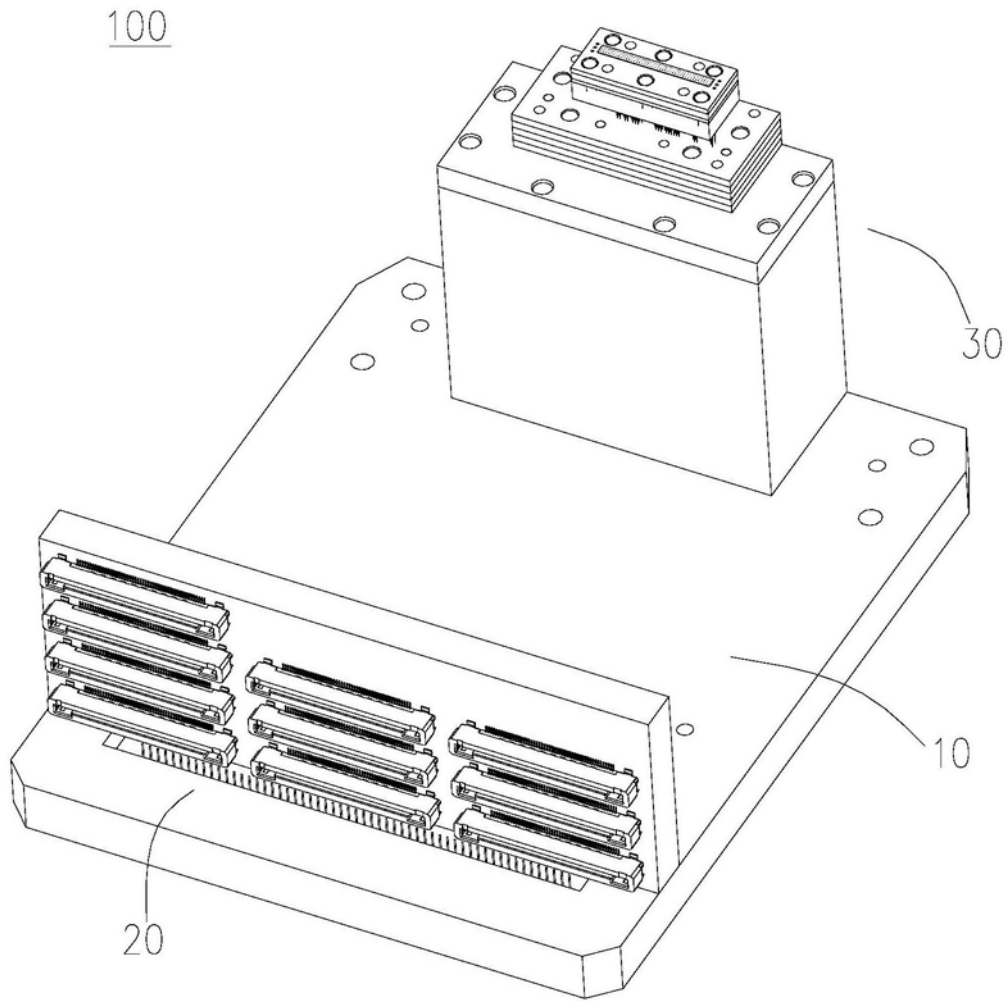


图5

专利名称(译)	OLED屏线路测试装置		
公开(公告)号	CN206819715U	公开(公告)日	2017-12-29
申请号	CN201720304868.X	申请日	2017-03-27
[标]申请(专利权)人(译)	苏州市科林源电子有限公司		
申请(专利权)人(译)	苏州市科林源电子有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	苏州市科林源电子有限公司		
[标]发明人	文东升		
发明人	文东升		
IPC分类号	G09G3/00		
代理人(译)	胡拥军 赵赛		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种OLED屏线路测试装置，包括一工作台、一连接结构及一测试结构，所述连接结构及所述测试结构分别固定安装于所述工作台，所述连接结构及所述测试结构与所述工作台电连接，所述测试结构包括一测试板及若干探针，所述若干探针固定安装于所述测试板并从所述测试板表面露出，所述若干探针通过所述工作台与所述连接结构电连接，所述若干探针用于接触OLED屏的线路进行线路检测。相比现有技术，本实用新型OLED屏线路测试装置的若干探针固定安装于测试板并从测试板表面露出，并且探针通过工作台与连接结构电连接，使探针能够接触OLED屏的线路进行线路检测，能够测试线宽线距很小的OLED屏线路。

